

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.01 **Květen 2010**

**Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky -
Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti
kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení**

ČSN
EN 60749-20
ed. 2
35 8799

idt IEC 60749-20:2008

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -
Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering
heat

Dispositifs a semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et climatiques -
Partie 20: Résistance des CMS a boîtiers plastique a l'effet combiné de l'humidité et de la chaleur de
brasage

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prüfverfahren -
Teil 20: Beständigkeit kunststoffverkappter oberflächenmontierbarer Bauelemente (SMD) gegenüber
der kombinierten Beanspruchung von Feuchte und Lötwärme

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60749-20:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60749-20:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-09-01 se nahrazuje ČSN EN 60749-20 (35 8799) z prosince 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma vyhodnocuje odolnost SMD součástek v plastových pouzdrech na kombinaci vlhkosti a tepla při pájení. Norma specifikuje provedení měřeného vzorku a umístění čidel. Definuje podmínky a způsob působení vlhkosti, předepsaný pájecí proces IR a konvekční pájení, pájení v parách a vlnou. Jsou uvedeny podmínky pro olovnatý i bezolovnatý pájecí proces. Jedná se o destruktivní test.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-09-01 používat dosud platná ČSN EN 60749-20 (35 8799) z prosince 2003, v souladu s předmluvou k EN 60749-20:2009.

Změny proti předchozím normám

Norma EN 60749-20:2009 obsahuje vzhledem k normě EN 60749-20:2003 tyto hlavní změny:

- sjednocuje klasifikaci EN 60749-20 a IPC/JEDEC J-STD-020C;
- odkaz EN 60749-35 místo přílohy A v EN 60749-20:2003;
- doplňuje bezolovnatou pájku;
- opravuje chyby v EN 60749-20:2003.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teple při pájení pro součástky s vývody (idt EN 60068-2-20:2008)

IEC 60749-3 zavedena v ČSN EN 60749-3 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 3: Vnější vizuální kontrola (idt EN 60749-3:2002)

IEC 60749-35 zavedena v ČSN EN 60749-35 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu (idt EN 60749-35:2006)

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČO: 00216305

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.